

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG dia. 19,1 mm, 355 nm



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock **#39-003** 9 In Stock

-

1

+

€158<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €158,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €147,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €131,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Beam Sampler

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

90 Ouverture Utile (%):

Diamètre (mm):

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 19.10 +0.00/-0.10               |                                                       |
| <3                              | Parallélisme (arcmin):                                |
| 6.35 ±0.20                      | Épaisseur (mm):                                       |
| Propriétés optiques             |                                                       |
| 0 ±5                            | Angle d'Incidence (°):                                |
| Laser V-Coat (355nm)            | Traitement:                                           |
| R <sub>abs</sub> <0.25% @ 355nm | Spécification du Traitement:                          |
| 355                             | Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):               |
| 1.458                           | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ):               |
| Fused Silica (Corning 7980)     | Substrat: <input type="checkbox"/>                    |
| λ/10                            | Planéité de Surface (P-V):                            |
| 10-5                            | Qualité de Surface:                                   |
| 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz   | Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/> |
| Conformité réglementaire        |                                                       |
| Conforme                        | RoHS 2015:                                            |
| Conforme                        | Reach 209:                                            |
| Visionner                       | Certificate of Conformance:                           |

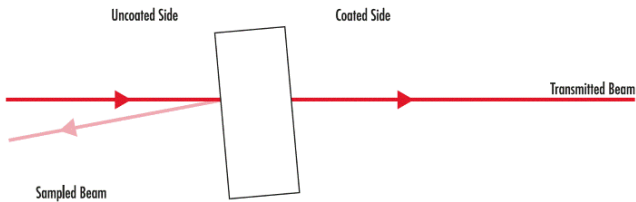
## Description produit

- La première surface non traitée fournit la réflexion de Fresnel
- Traitement avec seuil de dommage laser élevé sur une surface
- Qualité de surface de 10-5

Des Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG sont utilisés pour diviser une petite portion d'un faisceau laser incident via la réflexion de Fresnel fournie par la surface non traitée afin de surveiller le faisceau. Ces échantillonneurs de faisceau présentent d'excellentes propriétés physiques minimisant les effets sur le faisceau traversant, notamment une qualité de surface de 10-5 et une planéité de surface de λ/10. Un traitement antireflets avec seuil de dommage élevé est appliqué à la seconde surface pour limiter les réflexions fantômes. Les Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG sont fabriqués en silice fondue UV, ce qui permet une excellente transmission des UV aux IR et un faible coefficient de dilatation thermique. Des échantillonneurs de faisceau traités antireflets pour les raies laser antireflets aux longueurs d'onde de 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm sont disponibles.

**Remarque :** les Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser peuvent être utilisés avec des [produits de détection laser](#) pour la surveillance des propriétés du faisceau, telles que la puissance et le profil du faisceau, en temps réel.

## Informations techniques



Laser Line Beam Sampler

## Montures compatibles